



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)



(11)

EP 1 037 013 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
20.09.2000 Patentblatt 2000/38

(51) Int. Cl.⁷: G01B 11/27

(21) Anmeldenummer: 00105057.4

(22) Anmeldetag: 09.03.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 09.03.1999 DE 19910305

(71) Anmelder:
Prüftechnik Dieter Busch AG
85737 Ismaning (DE)

(72) Erfinder:
• Busch, Dieter
85737 Ismaning (DE)
• Hözl, Roland
81369 München (DE)
• Unger, Andreas
85748 Garching (DE)
• Pfister, Florian
81925 München (DE)
• Hermann, Michael
78050 Villingen (DE)

(54) Vorrichtung zur Paräzisionsausrichtung von Wellen, Walzen, Achsen, Spindeln oder Werkzeugmaschinen

(57) Die Vorrichtung zur Präzisionsmessung von Wellen, Spindeln oder dergleichen sieht zwei miteinander kombinierte Flächen vor, von denen eine teil- und die andere annähernd vollspiegelnd ist. Diese Flächen reflektieren einen auftreffenden Lichtstrahl unabhängig voneinander auf ein einziges optoelektronisches Target. Das Target kann zweidimensional ausgelesen werden

und ist pixelorientiert. Aus nur einer einzigen Messposition kann Azimut und Elevation sowie der Parallelversatz zwischen dem auftreffenden Lichtstrahl und einer zu den spiegelnden Flächen gehörenden zentral positionierten Normalen ermittelt werden.

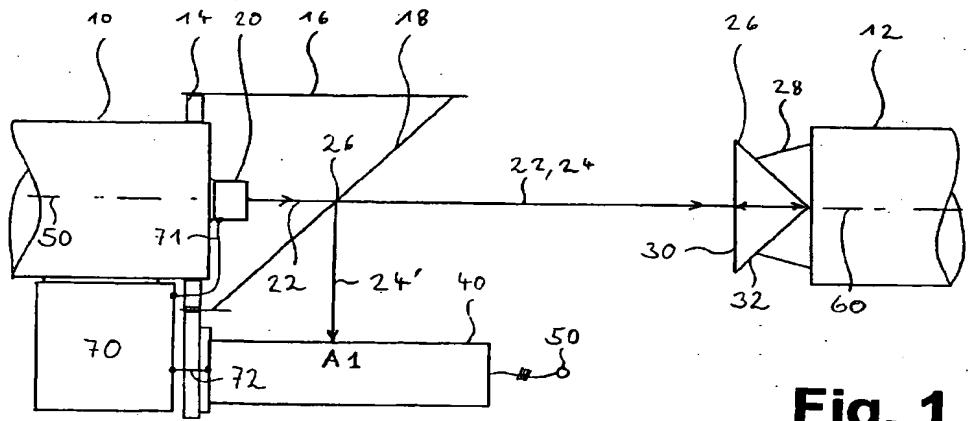


Fig. 1

Beschreibung

[Stand der Technik]

[0001] Vorrichtungen und Verfahren zur Vermessung und zur Präzisionsausrichtung von Wellen, Walzen, Achsen, oder Spindeln, Werkzeugmaschinen und deren Werkzeugen sind seit längerer Zeit bekannt. Eines dieser Verfahren beruht z.B. darauf, unter Verwendung autokollimatorisch arbeitender Vorrichtungen die obengenannten Gegenstände bezüglich einer Referenzebene oder eines weiteren solchen Gegenstandes mit hoher Präzision zu vermessen oder auszurichten.

[0002] Weitere Verfahren beruhen auf der in der US 4,698,491 angegebenen Lehre.

[0003] Den bekannten Verfahren ist gemein, dass die zu ihrer Ausführung benötigten Vorrichtungen mit hochwertigen optischen Komponenten bestückt sind, oder dass bei der Herstellung dieser Vorrichtungen spezielle kostenintensive Fertigungsschritte ausgeführt werden müssen. Dafür kann mit den genannten Vorrichtungen typischerweise eine erstaunliche Vielzahl an Messaufgaben erledigt werden.

[Aufgabe der Erfindung]

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Messvorrichtung anzugeben, mit welcher Präzisionsmessungen hinsichtlich der Ausrichtung zweier Gegenstände durchführbar sind, wobei diese Gegenstände in fluchtender Weise zueinander angeordnet sind, d.h. parallel zueinander stehende Symmetriearchsen oder -linien aufweisen. Die Gegenstände sind dabei zumeist von einander beabstandet, d.h. sie weisen einen lichten Zwischenraum nicht allzukleinen Ausmaßes auf. Es ist Aufgabe der Erfindung, unter Berücksichtigung dieser speziellen Randbedingung eine Messanordnung anzugeben, welche insbesondere kostengünstiger erstellt werden kann, als dies bislang möglich war, darüberhinaus eine verbesserte Messgenauigkeit aufweist, und zusätzlich nicht darauf angewiesen ist, eine Messung in mehreren einzelnen Mess-Schritten oder Mess-Phasen abzuarbeiten, sondern Messergebnisse anhand einer einzigen Einstellung bereitzustellen, was als ganz wesentlicher Vorteil angesehen wird. Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass gemäß der Erfindung eine Vorrichtung zum Ausrichten von Wellen, Walzen, Spindeln oder anderen Gegenständen zueinander vorgestellt wird, welche in einer bevorzugten Ausführungsform folgendes aufweist:

eine an einem ersten Zylinder oder Prisma (z.B. Welle, Rohr, Hohlzylinder) an dessen stirnseitigem Ende im wesentlichen zentriert angebrachten Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahls,

ein einziges flächiges lichtempfindliches Element, welches geeignet ist, Lichtpunkte, welche auf dieses abgebildet werden, nach zwei linearen Koordi-

naten und nach Intensität zu vermessen, und welches in Bezug zur genannten Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahles fest beabstandet ist, ein erstes und ein zweites reflektierendes optisches Element, welche an einem zweiten Zylinder oder Prisma (z.B. Welle, Rohr, Hohlzylinder) angebracht sind, wobei der zweite Zylinder oder Prisma distal von dem ersten Zylinder oder Prisma beabstandet ist, und wobei die zwei reflektierenden optischen Elemente eine feste räumliche Zuordnung zueinander und zum zweiten Zylinder oder Prisma aufweisen, und wobei das erste reflektierende optische Element nach Massgabe eines Winkelversatzes zwischen dem genannten ersten und zweiten Zylinder oder Prisma einen von der Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahles generierten Lichtstrahl in vordefiniert funktionsmässiger erster Weise auf das flächige lichtempfindliche Element reflektiert, und wobei das zweite reflektierende optische Element nach Massgabe eines Lateralversatzes zwischen dem genannten ersten und zweiten Zylinder bzw. Prisma den gleichen genannten generierten Lichtstrahl in vordefiniert funktionsmässiger zweiter Weise auf das flächige lichtempfindliche Element reflektiert.

[0005] Die genannten "vordefiniert funktionsmässigen Weisen" ergeben sich dabei im wesentlichen nach den bekannten Sätzen über optisch spiegelnde Flächen, insbesondere Spiegelung eines Lichtstrahles an einer ebenen Fläche und Spiegelung eines Lichtstrahles an einer gekrümmten, z.B. sphärischen Fläche. Weiterhin sind gegebenenfalls die funktionalen Zusammenhänge beim Durchgang eines einfallenden oder reflektierten Lichtstrahles durch ein optisches Medium zu beachten, wie sich dies z.B. aus der Behandlung von Linsen oder Prismen ergibt.

[0006] Insbesondere beruht die Erfindung darauf, dass ein lichtoptischer Sender und ein lichtoptischer

40 Empfänger mit einer optischen Vorrichtung kombiniert werden, die in kombinierter Weise zwei gleichzeitig wirkende reflektierende optische Elemente vorsieht. Dabei dient in dieser innovativen Kombination ein erstes 45 reflektives optisches Element zum Nachweis eines eventuell vorhandenen Winkelversatzes (in Azimut und Elevation) zwischen den beiden genannten Gegenständen, (wie z.B. Wellen, Röhren, Hohlzylindern, oder Achsen, insbesondere Wellen oder Achsen von Werkzeugmaschinen), und ein zweites reflektives optisches Element ist dazu vorgesehen, einen eventuell 50 vorhandenen Parallel- oder Lateralversatz zwischen den beiden genannten Gegenständen nachzuweisen. (Auch der Parallel- oder Lateralversatz ist in zwei zueinander senkrecht stehenden Koordinaten nachweisbar.) 55 Beide reflektiv wirkenden optischen Elemente sind dabei in stabiler Weise fest gegeneinander orientiert und beabstandet. In einer speziellen Ausführungsform der Erfindung kann auf die Verwendung von Linsen ver-

zichtet werden. Die Erfindung beruht weiterhin darauf, dass als lichtempfindlicher flächiger Detektor ein zweidimensional auslesbares, pixelorientiertes CCD- oder CMOS-Array vorgesehen wird, welches von Haus aus hervorragende geometrisch-optische Eigenschaften aufweist. Dessen Fähigkeit, quasi gleichzeitig mehrere Lichtpunkte auf seiner Oberfläche detektieren zu können und gleichzeitig eine Angabe bezüglich derer Intensität zu liefern, wird für eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung in vorteilhafter Weise genutzt.

[Beispiele]

[0007] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines in den Figuren gezeigten Beispiels erläutert.

[0008] Es zeigt

Fig. 1 eine erste Querschnittsansicht einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, sowie einen Strahlengang bei perfekt ausgerichteter Maschine oder Gegenständen

Fig. 2 eine zweite Querschnittsansicht, jedoch mit einem ersten Strahlengang bei angular und linear/translatorisch fehlerhaft ausgerichteter Maschine oder Gegenständen

Fig. 3 eine dritte Querschnittsansicht ähnlich Fig. 2, wobei jedoch ein zweiter Strahlengang ausgewiesen ist, ausserhalb des sonst als Retroreflektor wirkenden Tripelprismas

Fig. 4 eine vierte Querschnittsansicht ähnlich Fig. 3, bei der das Tripelprisma durch eine frontseitig teilverspiegelte und rückseitig vollverspiegelte plano-konvexe Linse ersetzt ist.

[0009] Die in Fig. 1 gezeigte Welle 10 ist typischerweise von kreisrundem Querschnitt und hoher Präzision. Sie wird bevorzugt an vordefinierte Anlageflächen von Maschinen oder Gegenständen angelegt, und kann insbesondere in Spannzangen oder Werkzeugaufnahmen von Werkzeugmaschinen eingespannt werden. Auf dem stirnseitigen Ende der Welle 10 ist eine lichtemittierende Vorrichtung 20, z.B. ein Halbleiterlaser, angebracht, mit welcher ein schmaler und bevorzugt paralleler Lichtstrahl erzeugt werden kann, dessen Haupt-Ausbreitungsrichtung mit der Achse 50 der Welle 10 koinzidiert. Anstelle des Lasers kann auch eine Leuchtdiode samt Fokussierungseinrichtung verwendet werden, oder andere lichtemittierende Einrichtungen, welche nicht-kohärentes, insbesondere mehrfarbiges Licht abgeben. Die lichtemittierende Vorrichtung 20 ist dabei bevorzugt so angebracht, dass das Zentrum ihrer Emissions-Apertur auf der Achse 50 zu liegen kommt. Eine geeignete, an sich bekannte Energieversorgung der Vorrichtung 20 ist dabei durch eine Stromversorgung 70 vorgesehen, welche zum Beispiel eine Batterie enthält, und mittels eines mehrdrähtigen elektrischen Kabels 71 mit der Vorrichtung 20 verbunden ist.

[0010] Bezugsziffern 14 und 16 bezeichnen eine Halterung bzw. einen abgeschrägten Tubus, welcher dazu dient, einen teildurchlässigen Spiegel 18 in fester Orientierung und Beabstandung zur lichtemittierenden Vorrichtung 20 zu tragen. Die Teildurchlässigkeit kann z.B. 50% betragen. - Ebenfalls fix zu dieser ist ein flächiger optoelektronischer Sensor oder Element 40 angebracht, welches z.B. mittels einer Verkabelung 72 bestromt wird und einen Signalausgang 50 aufweist, wie er an sich nach dem Stand der Technik bekannt ist und typisch zwei Leiter verwendet.

[0011] Ein von der lichtemittierenden Vorrichtung 20 emittierter Lichtstrahl 22 durchquert distal den oben genannten lichten Zwischenraum zwischen Welle 10 und Welle 12 bzw. den an diesen angebrachten mess-technischen Komponenten. In Fig. 1 wird gezeigt, wie dieser Lichtstrahl 22 durch eine teil-spiegelnde plane Frontfläche 30 eines (als Retroreflektor wirkenden) Tripel-Spiegels oder Tripel-Prismas 32 hindurchtritt, welche Frontfläche einen Reflexionsgrad von 5% bis 70% aufweisen kann. Das Tripelprisma (in Fig. 1 bis 3 vereinfacht dargestellt) weist in bekannter Art drei senkrecht aufeinanderstehende spiegelnde Flächen auf, deren eine z.B. mit Bezugsziffer 26 identifiziert ist. In das Tripelprisma 30 eintretende Lichtstrahlen werden mit achsialem Versatz, aber parallelgerichtet reflektiert. Das gezeigte Beispiel zeigt einen parallel und koinzident reflektierten Lichtstrahl 24, im Falle exakt aufeinander ausgerichteter Wellen 10 und 12.

[0012] Dieser Lichtstrahl 24 wird am teilverspiegelten planen Reflektor 18 gespiegelt und trifft als Lichtstrahl 24' auf einen Punkt A1 des flächigen optoelektronischen Elements 40, welches im folgenden als Empfänger bezeichnet wird. Der Auf treffpunkt A1 kann nach zwei linearen Koordinaten bestimmt werden, welche die lichtempfindliche Ebene des Empfängers 40 definieren. Der Auf treffpunkt A1 definiert also eine Idealposition, welche bei exakt ausgerichteten Wellen 10 in Erscheinung kommt und mit an sich bekannten elektronischen Mitteln registriert werden kann. Zu diesem Zweck ist es jedoch erforderlich, dass das Tripelprisma 32 mittels geeigneter und stabiler Haltevorrichtungen 28 an der Welle 12 in exakter Weise befestigt ist, so dass die Flächennormale der Oberfläche 30 parallel zur Achse 60 (auch Seele genannt) der Welle 12 verläuft. Ähnlich wie Welle 10 ist auch Welle 12 bevorzugt von kreisrundem Querschnitt und kann gemäß einer bevorzugten Anwendung der Erfindung in eine Spannzange oder eine Werkzeughalterung einer Werkzeugmaschine eingespannt werden, was hier nicht näher gezeigt ist. - Wie in Fig. 1 gezeigt, durchstößt die Achse 60 die Spitze des Tripelprismas 32. In einer abgewandelten Ausführungsform der Erfindung ist ein definierter Versatz dieser Spitze gegenüber der Achse 60 vorgesehen, welche Achse jedoch weiterhin senkrecht zur Oberfläche 30 orientiert sein soll. Der Grund für diese asymmetrische Anordnung wird anhand der folgenden Erörterungen ersichtlich.

[0013] In Fig. 2 wird ein Teil der Verhältnisse gezeigt, die bei einer gegenüber Welle 10 angular (Winkel alpha) und lateral (Verschiebung "s") versetzten Welle 12 auftreten, nämlich der Strahlengang eines emittierten Lichtstrahles 30, welcher an den vollverspiegelten reflektierenden Seitenflächen (z.B. 33) des Tripelspiegels 32 mehrfach reflektiert wird und dieses dann unter parallelem Versatz als Lichtstrahl 25 verlässt. (Fig. 2 ist aus Gründen der Verdeutlichung winkehmässig stark überhöht gezeichnet). Lichtstrahl 25 wird in Punkt 26' durch den teilverspiegelten ebenen Reflektor 18 in Richtung des Empfängers 40 abgelenkt und trifft dort in Punkt A2 auf Wie gezeichnet, ist dieser mit einem Mass 2s in Richtung des emittierten Lichtstrahls 30 vom Auftreffpunkt A1 beabstandet. Wie man erkennt, spielt für den in Fig. 2 gezeigten Strahlengang der angulare Versatz der Welle 12 zunächst keine Rolle, nur der laterale Versatz "s" führt zu einer Verlagerung des von den genannten reflektierenden Flächen reflektierenden Strahles 25.

[0014] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist entscheidendes Merkmal der Erfindung die gleichzeitige Verwendung eines zusätzlichen Reflektors, nämlich in Form der teilspiegelnden Frontfläche 30 des Tripelprismas 32. Dadurch wird ein vorgegebener Anteil, der z.B. 50% der Intensität des Strahles 22 betragen kann, direkt als Strahl 23 auf den Reflektor 18 zurückgeworfen, wo er auf Punkt 27 auftrifft und von dort als Strahl 23' zum Auftreffpunkt B1 auf dem Empfänger 40 reflektiert wird. Bei der genannten 50% Verspiegelung der Fläche 30 ist Strahl 23 daher deutlich intensiver als die Strahlen 24 und 25, welche einem zusätzlichen Abschwächungsvorgang unterworfen werden, aufgrund eines zweimaligen Durchtritts durch die Fläche 30. Damit unterscheidet sich der an Punkt B1 zu registrierende Lichtpunkt deutlich von denen, die bei A2 zu registrieren sind. Da es vorteilhaft ist, die Punkte A2 und B1 in jedem Falle voneinander unterscheiden zu können, was im Falle des Punktes A1 (Fig. 1) nicht der Fall ist, ist es wie bereits erwähnt von Vorteil, das Tripelprisma 32 mit axialem Versatz gegenüber der Achse 60 zu montieren. Auf diese Weise gelingt eine Unterscheidung derjenigen Strahlen, welche von einem ersten reflektierenden Element beeinflusst wurden, von denjenigen Strahlen, welche von einem zweiten reflektierenden optischen Element beeinflusst wurden. Von Bedeutung ist dabei folgendes: Die Richtung der in Fig. 3 gezeigten, durch Fläche 30 gespiegelten Strahlen, ist praktisch nur davon abhängig, welcher angularer Versatz zwischen Achsen 50 und 60 (gemessen nach zwei Koordinaten, i.e. Azimut und Elevation) vorhanden ist. Ein lateraler Versatz von Achse 60 relativ zu Achse 50 hat auf den Strahlengang für Strahl 23 praktisch keinen Einfluss mehr und kann gegebenenfalls mittels einer Korrekturrechnung berücksichtigt werden. Dadurch ist es möglich, mittels der beiden Koordinaten des Punktes B1 auf der lichtempfindlichen Ebene des Empfängers 40 auf die Winkelkoordinaten des angularen Versatzes zwis-

schen den Wellen 50 und 60 zu schliessen.

[0015] Eine dem Empfänger nachgeschaltete Elektronik muss daher nur herausfinden, durch welche Koordinaten der Punkt B1 und durch welche Koordinaten der Punkt A2 beispielsweise definiert ist. Anhand dieser Angaben kann in weiteren Rechnungsschritten, die durch einen zugehörigen Computer (nicht gezeigt) ausgeführt werden, ein eventuell vorhandener Fehversatz zwischen den Wellen 10 und 12 bestimmt werden.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Anhand solcher Resultate kann sogleich, d.h. ohne weitere Drehung der Wellen oder Anfahren zusätzlicher Messpositionen, eine Korrekturmassnahme durchgeführt werden, welche zum Ziel hat, die Achsen 50 und 60 koinzident zu machen.

[0016] Soll die Genauigkeit der Analyse hinsichtlich eines geringfügigen Fehlversatzes gesteigert werden, so ist es jedoch auch möglich, einen Satz Messergebnisse zu erhalten und entsprechend auszuwerten, indem für verschiedene Drehlagen der Welle 10 jeweils ein zugehöriges Messergebnis bestimmt wird. Anstelle eines einzelnen Punktes A2 oder B1 werden somit Linien definiert, deren kennzeichnenden Parameter (z.B. Schwerpunkt, Mittelpunkt, Streuungen usw.) dazu herangezogen werden, Idealwerte für die genannten Punkte zu errechnen, welche dann einem weiteren Rechnungsgang zugeführt werden, so dass verfeinerte Messwerte für allfällige Korrekturvorbereitung an den Wellen zur Verfügung stehen.

[0017] In vergleichbarer Weise kann ein verbessertes Ergebnis dadurch bereitgestellt werden, dass bei festgehaltener Welle 10 nur die Welle 12, samt montierten reflektierenden Elementen, gedreht wird und für eine gewisse Anzahl an Drehlagen ebenfalls einzelne Messwerte bestimmt werden.

[0018] In ebenfalls vergleichbarer Weise kann ein verbessertes Ergebnis der Messung dadurch bereitgestellt werden, dass Wellen 10 und 12 synchron gedreht werden, und für eine Anzahl an Drehlagen die Positionen der Auftreffpunkte A2, B1 bestimmt, registriert und ausgewertet werden.

[0019] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung können anstelle der ebenen reflektierenden Flächen des Tripelspiegels solche von gekrümmter, insbesondere sphärischer Form, vorgesehen sein, was jedoch die Analyse von identifizierten Auftreffpunkten A2, B1 deutlich schwieriger und aufwendiger macht. Zum Beispiel kann das Tripelprisma 32 durch eine teil- und vollverspiegelte plankonvexe Linse ersetzt werden, welche viel kostengünstiger hergestellt werden kann als das Tripelprisma.

[0020] Dies wird in Fig. 4 dargestellt. Auf die Welle 12 ist die frontseitig teilverspiegelte und rückseitig vollverspiegelte plano-konvexe Linse angebracht. Die teilspiegelnde Schicht 130 ist zum Beispiel ca. 40 % reflektierend. Der Hauptanteil des dort reflektierten Lichtes liegt im grünen Spektralbereich. Ein auftreffender z.B. grünes und gelbes Licht enthaltender Lichtstrahl 22 wird im Punkt 200 anteilig, z.B. mit im

wesentlichen grüner Farbe, als Strahl 23 reflektiert, nach Massgabe der winkelmässigen Orientierung der Welle 12. Das nicht reflektierte Licht gelangt bis zum Auftreffpunkt 210, von wo es als Lichtstrahl 125 mit den entsprechenden verbleibenden spektralen Komponenten reflektiert wird, um in der Nähe der Teilverspiegelungsschicht 130 aus der Linse wieder auszutreten. Die restlichen Gegebenheiten entsprechen denen der Fig. 3.

5

10

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Ausrichten von Wellen, Walzen, Spindeln oder anderen Gegenständen zueinander, mit

15

einer an einem ersten Zylinder oder Prisma an dessen stirnseitigem Ende im wesentlichen zentriert angebrachten Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahls, einem einzigen flächigen lichtempfindlichen Element, welches geeignet ist, Lichtpunkte, welche auf dieses abgebildet werden, nach zwei linearen Koordinaten und nach Intensität zu vermessen, und welches in Bezug zur genannten Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahles fest beabstandet ist.

20

mit einem ersten und einem zweiten reflektierenden optischen Element, welche Elemente an einem zweiten Zylinder oder Prisma angebracht sind, wobei der zweite Zylinder distal von dem ersten Zylinder oder Prisma beabstandet ist, und wobei die zwei reflektierenden optischen Elemente eine feste räumliche Zuordnung zueinander und zum zweiten Zylinder oder Prisma aufweisen, und wobei das erste reflektierende optische Element nach Massgabe eines Winkelversatzes zwischen dem genannten ersten und zweiten Zylinder oder Prisma einen von der Einrichtung zur Erzeugung eines Lichtstrahles generierten Lichtstrahl in vordefiniert Funktionsmässiger erster Weise auf das flächige lichtempfindliche Element reflektiert, und wobei das zweite reflektierende optische Element nach Massgabe eines Lateralversatzes zwischen dem genannten ersten und zweiten Zylinder oder Prisma den gleichen genannten generierten Lichtstrahl in vordefiniert funktionsmässiger zweiter Weise auf das flächige lichtempfindliche Element reflektiert.

25

30

35

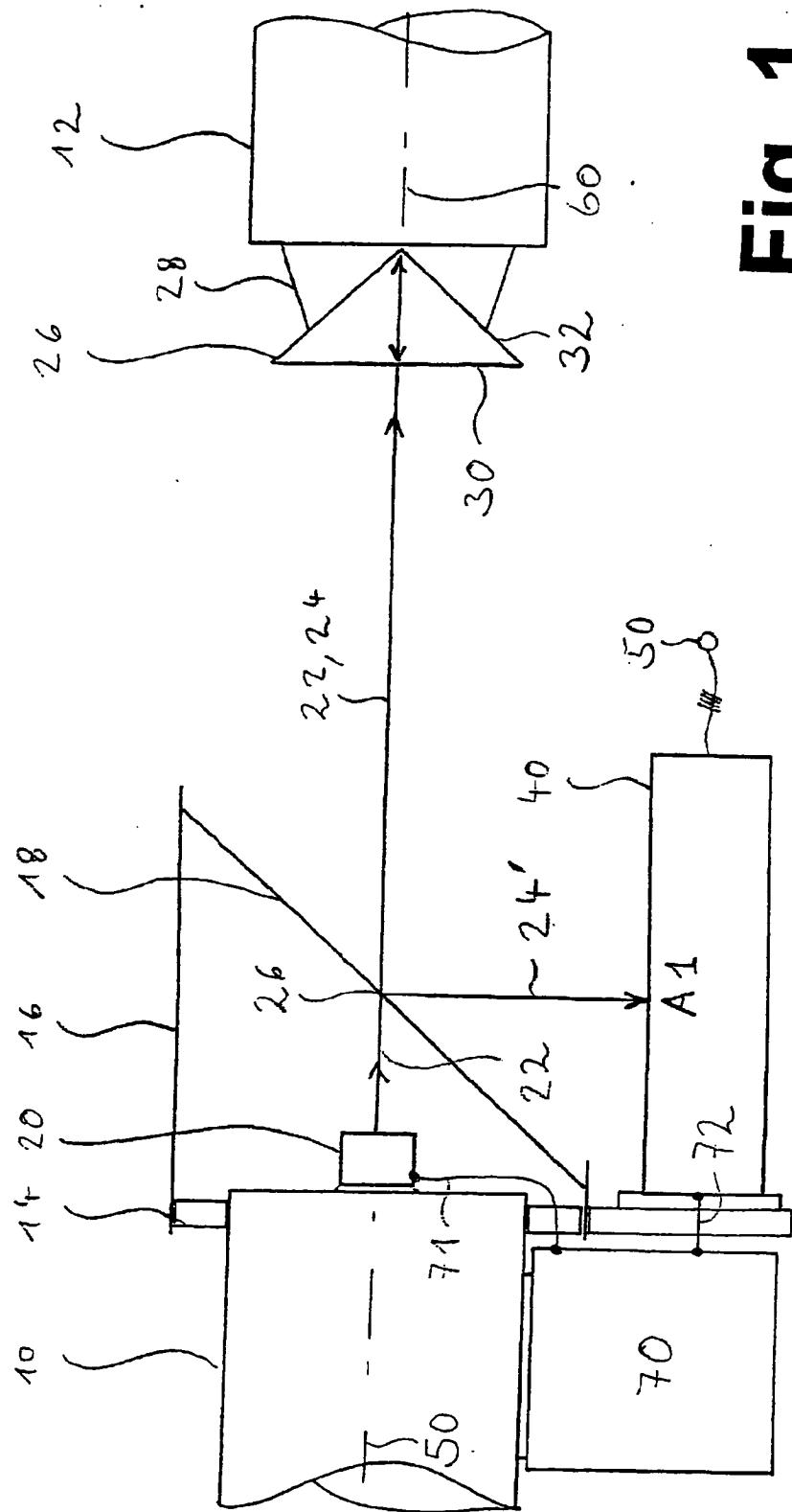
40

45

50

55

Fig. 1



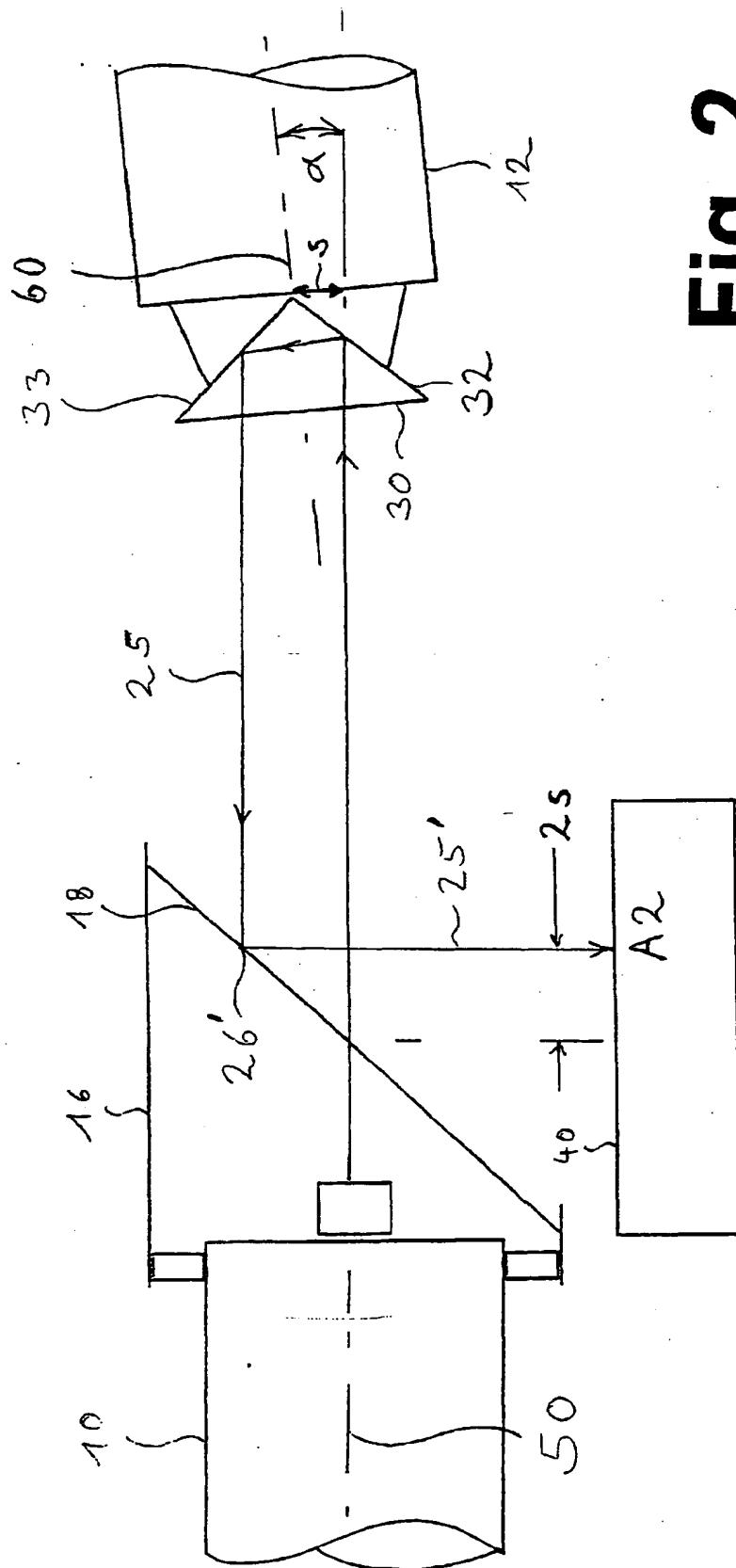


Fig. 2

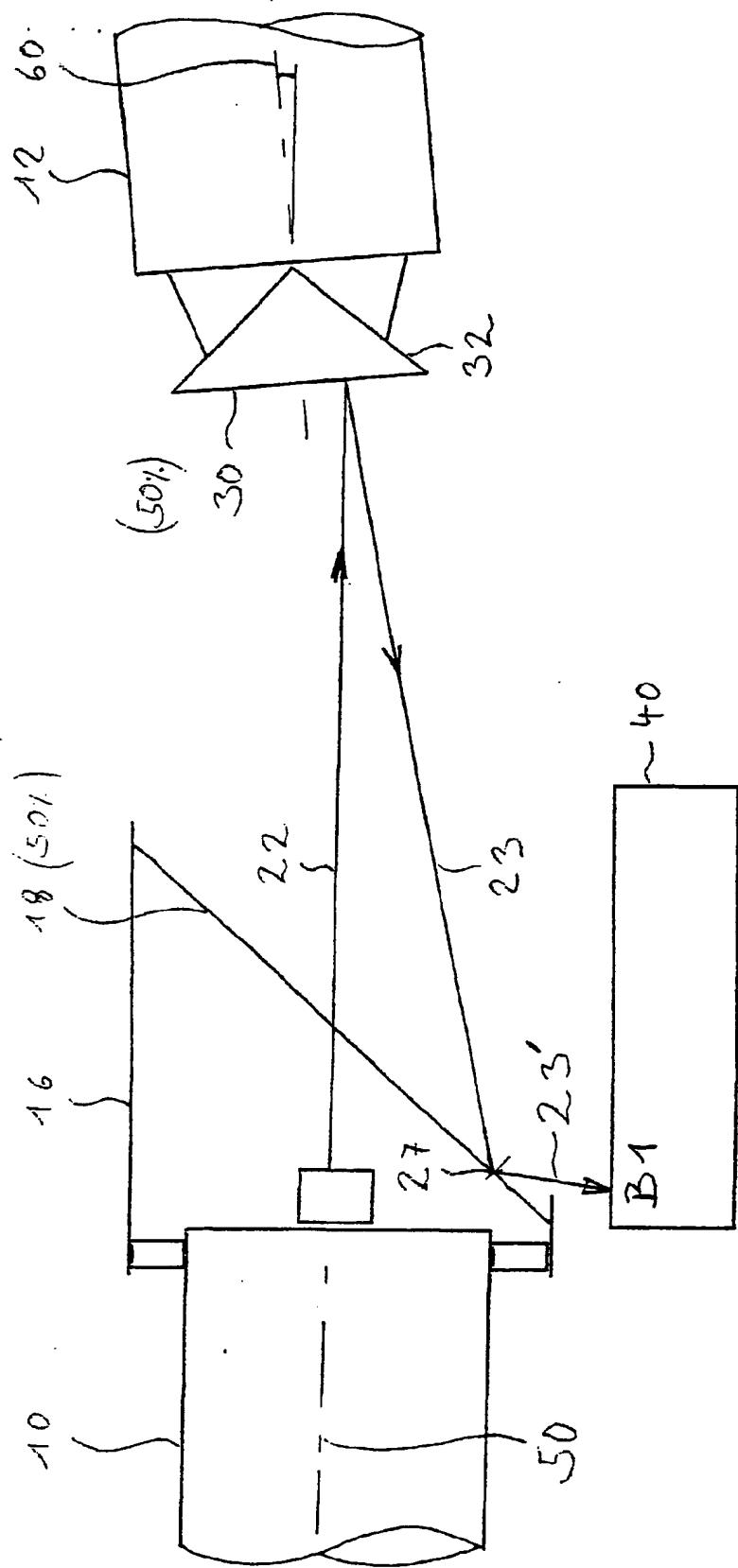


Fig. 3

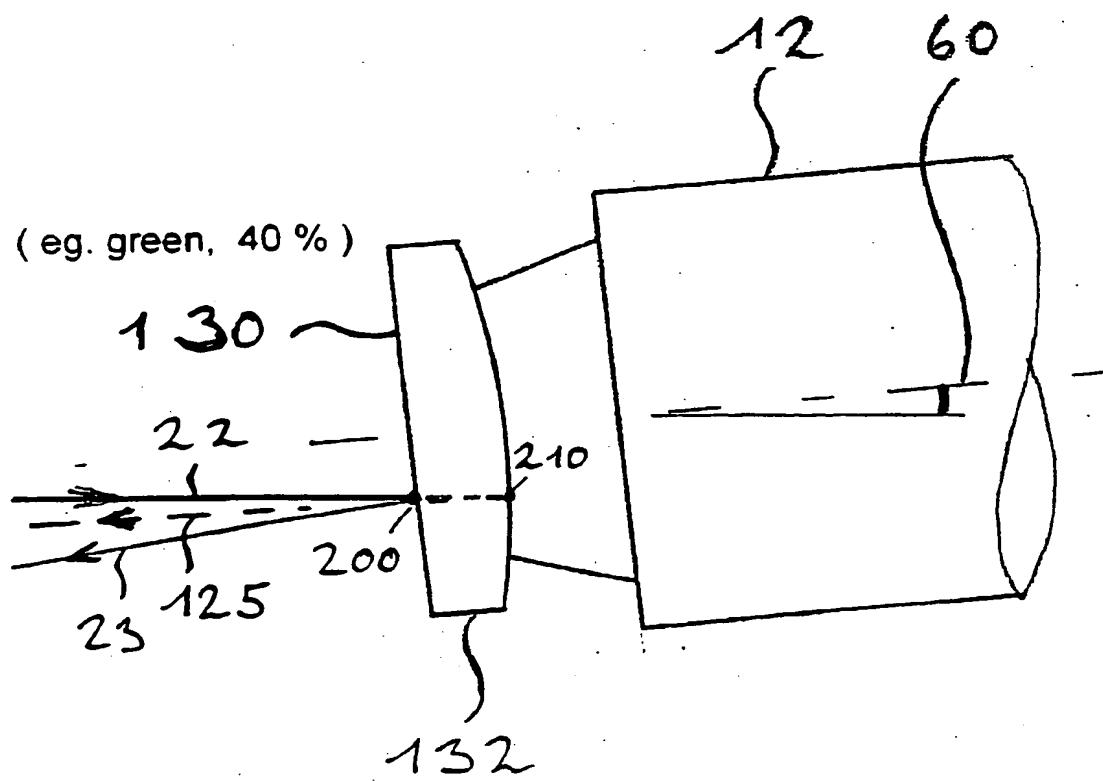
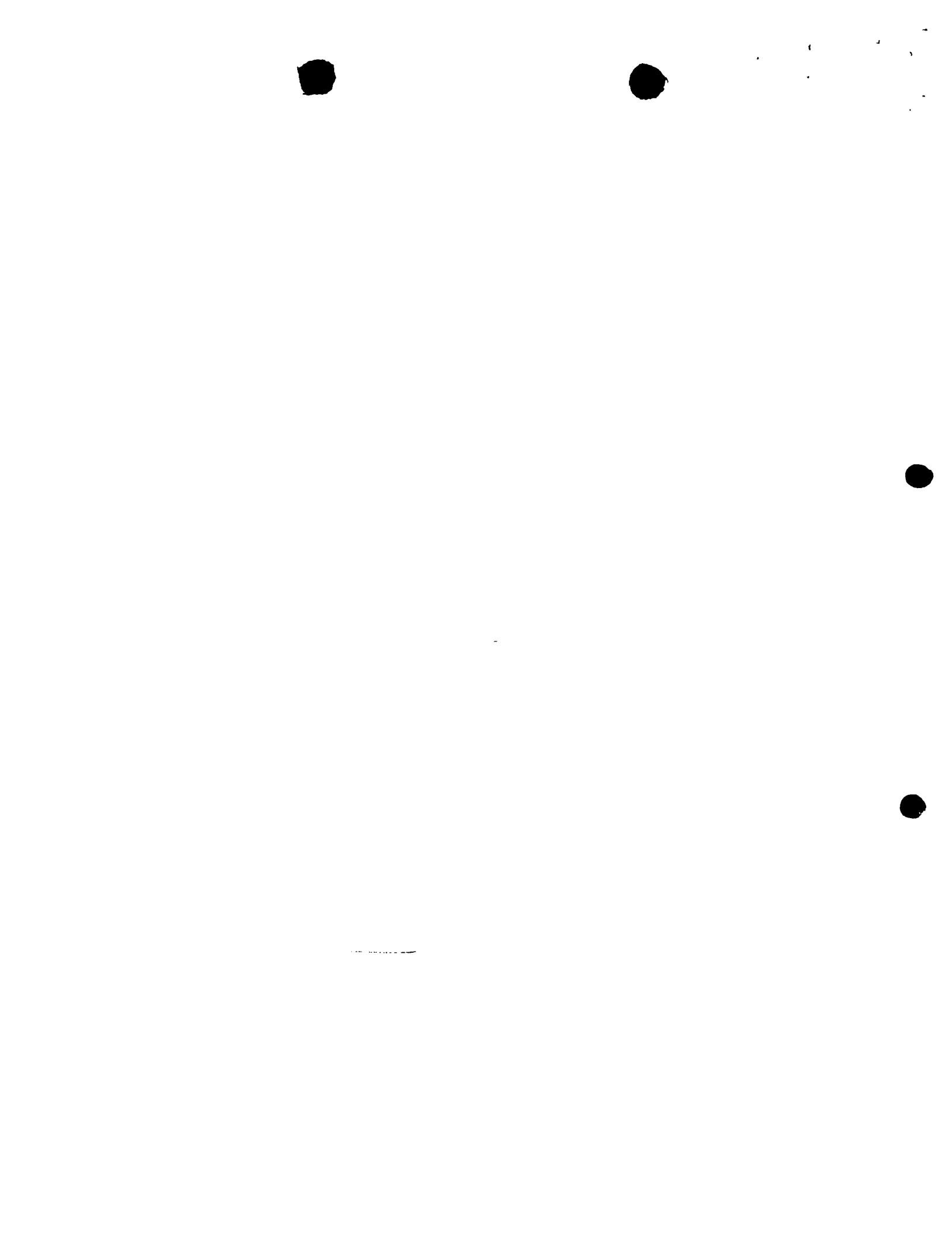
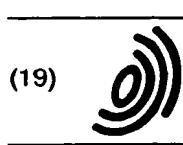


Fig. 4





(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 037 013 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
11.10.2000 Patentblatt 2000/41

(51) Int. Cl. 7: G01B 11/27

(43) Veröffentlichungstag A2:
20.09.2000 Patentblatt 2000/38

(21) Anmeldenummer: 00105057.4

(22) Anmeldetag: 09.03.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SEBenannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 09.03.1999 DE 19910305

(71) Anmelder:
Prüftechnik Dieter Busch AG
85737 Ismaning (DE)(72) Erfinder:
• Busch, Dieter
85737 Ismaning (DE)
• Hözl, Roland
81369 München (DE)
• Unger, Andreas
85748 Garching (DE)
• Pfister, Florian
81925 München (DE)
• Hermann, Michael
78050 Villingen (DE)

(54) Vorrichtung zur Parzisionsausrichtung von Wellen, Walzen, Achsen, Spindeln oder Werkzeugmaschinen

(57) Die Vorrichtung zur Präzisionsmessung von Wellen, Spindeln oder dergleichen sieht zwei miteinander kombinierte Flächen vor, von denen eine teil- und die andere annähernd vollspiegelnd ist. Diese Flächen reflektieren einen auftreffenden Lichtstrahl unabhängig voneinander auf ein einziges optoelektronisches Target. Das Target kann zweidimensional ausgelesen werden

und ist pixelorientiert. Aus nur einer einzigen Messposition kann Azimut und Elevation sowie der Parallelversatz zwischen dem auftreffenden Lichtstrahl und einer zu den spiegelnden Flächen gehörenden zentral positionierten Normalen ermittelt werden.

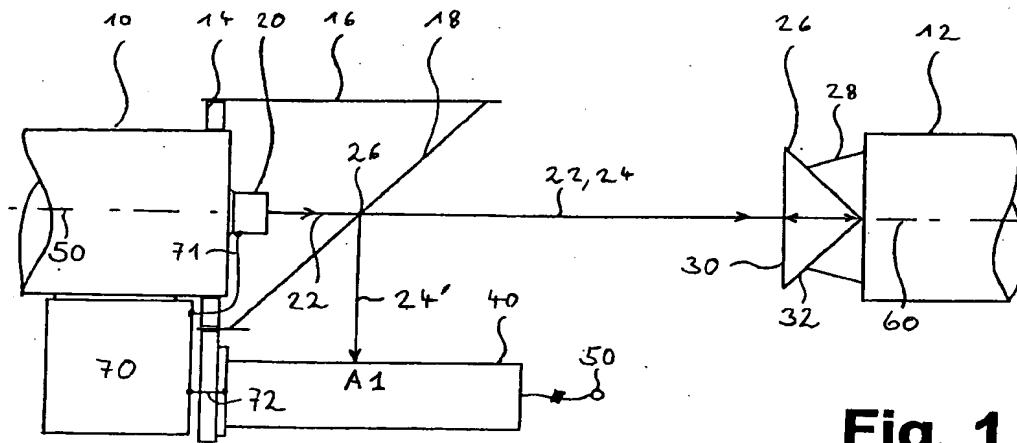


Fig. 1



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrift Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL 7)
Y, D	US 4698491 A (LYSEN) 06 Oktober 1987, Ansprüche. --	1	G01B11/27
Y	GB 2219076 A (COAL INDUSTRY LIMITED) 29 November 1989, Ansprüche. --	1	
A	GB 2237380 A (HAMAR M.R.) 01 Mai 1991. --	1	
A	DE 3335336 A (MALAK ST.P.) 05 April 1984. -----	1	
RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int. Cl. 7)			
G01B			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN	Abschlussdatum der Recherche 21-06-2000	Prüfer NARDAI	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmelde datum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR: EP 00105057.4**

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der EPIDOS-INPADOC-Datei am 04.07.00. Diese Angaben dienen zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführte Patentdokumente	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung
US A 4698491	06-10-1987	DE A1 3320163			13-12-1984
		DE C0 3473344			15-09-1988
		EP A1 145745			26-06-1985
		EP B1 145745			10-08-1986
		FR A1 2547915			28-12-1984
		FR B1 2547915			12-01-1990
		IT A0 8404836			31-05-1984
		IT A 1214799			18-01-1990
		JP T2 60501523			12-09-1985
		JP B4 3009402			08-02-1991
		WO A1 8404960			20-12-1984
GB A1 2219076	29-11-1989	AU A1 20549/88			16-02-1989
GB B2 2219076	03-07-1991	AU B2 599259			12-07-1990
		EP A2 303352			15-02-1989
		EP A3 303352			26-06-1991
		GB A0 8719154			23-09-1987
		JP A2 1059116			06-03-1989
		US A 4869591			26-09-1989
		ZA A 8805451			26-04-1989
GB A1 2237380	01-05-1991	CA AA 2023306			27-04-1991
GB B2 2237380	19-05-1993	DE A1 4034302			02-05-1991
		GB A0 9017583			26-09-1990
		JP A2 3142141			17-06-1991
		JP B2 2928355			03-08-1999
		US A 5224052			29-06-1993
		US A 5302833			12-04-1994
DE A1 3335336	05-04-1984	AU A1 19640/83			05-04-1984
DE C2 3335336	18-05-1995	AU B2 567511			26-11-1987
		CA A1 1220330			14-04-1987
		FR A1 2534017			06-04-1984
		GB A0 8326241			02-11-1983
		GB A1 2128324			26-04-1984
		GB B2 2128324			10-09-1986
		IT A0 8349052			28-09-1983
		IT A 1168893			20-05-1987
		JP A2 59084107			15-05-1984
		US A 4518855			21-05-1985

Bezüglich näherer Einzelheiten zu diesem Anhang siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamtes, Nr. 12/82.



THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK